

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】平成19年5月10日(2007.5.10)

【公開番号】特開2006-3227(P2006-3227A)

【公開日】平成18年1月5日(2006.1.5)

【年通号数】公開・登録公報2006-001

【出願番号】特願2004-180023(P2004-180023)

【国際特許分類】

G 0 1 R 31/28 (2006.01)

【F I】

G 0 1 R 31/28 H

【手続補正書】

【提出日】平成19年3月15日(2007.3.15)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

被試験対象を試験するICテストにおいて、

設定値または変数が定義される設定値データの実行順が示される実行順データに基づいて、実行命令及び変数の設定値を出力するテストシステムコントローラと、

前記設定値データと前記実行順データに基づいて、設定値データの設定準備を行い、前記テストシステムコントローラからの実行命令及び変数の設定値により、設定値の設定を行い、前記被試験対象と信号の授受を1ピン以上行える複数のピンエレクトロニクスカードと

を備えたことを特徴とするICテスト。

【請求項2】

テストシステムコントローラは、

少なくとも実行順データ、変数の設定値を記憶する第1の記憶部と、

この記憶部の実行順データ、変数の設定値に基づいて、実行命令及び設定の変数値を出力する第1の制御部と

を有し、

ピンエレクトロニクスカードは、

設定データ、実行順データを記憶する第2の記憶部と、

この第2の記憶部の実行順データに基づいて、第2の記憶部の設定データを準備し、前記第1の制御部の実行命令及び変数の設定値により、設定値を設定する第2の制御部とを設けたことを特徴とする請求項1記載のICテスト。

【請求項3】

ピンエレクトロニクスカードは、テストシステムコントローラから変数の設定値を受け取り、設定データの変数を固定値にすることを特徴とする請求項1または2記載のICテスト。

【請求項4】

ピンエレクトロニクスカードは、所望の変数のみ固定値にすることを特徴とする請求項3記載のICテスト。

【請求項5】

被試験対象を試験するICテストにおいて、

実行命令を出力するテストシステムコントローラと、
設定値が定義される設定値データとこの設定データの実行順が示される実行順データと
に基づいて、設定値データの設定準備を行い、前記テストシステムコントローラからの実
行命令により、設定値の設定を行い、前記被試験対象と信号の授受を1ピン以上行える複
数のピンエレクトロニクスカードと
を備えたことを特徴とするICテスタ。

【請求項6】

テストシステムコントローラは、
少なくとも実行順データを記憶する第1の記憶部と、
この記憶部の実行順データに基づいて、実行命令を出力する第1の制御部と
を有し、
ピンエレクトロニクスカードは、
設定データ、実行順データを記憶する第2の記憶部と、
この第2の記憶部の実行順データに基づいて、第2の記憶部の設定データを準備し、前
記第1の制御部の実行命令により、設定値を設定する第2の制御部と
を設けたことを特徴とする請求項5記載のICテスタ。

【請求項7】

被試験対象を試験するICテスタにおいて、
実行命令を出力するテストシステムコントローラと、
設定値が定義される設定データ、この設定データの実行順が示される実行順データを記
憶する複数の記憶部と、
この記憶部の実行順データに基づいて、記憶部の設定データを準備し、前記テストシス
テムコントローラの実行命令により、設定値を設定する複数の制御部と
を設けたことを特徴とするICテスタ。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0006

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0006】

このような課題を達成するために、本発明のうち請求項1記載の発明は、
被試験対象を試験するICテスタにおいて、
設定値または変数が定義される設定値データの実行順が示される実行順データに基づいて、実行命令及び変数の設定値を出力するテストシステムコントローラと、
前記設定値データと前記実行順データに基づいて、設定値データの設定準備を行い、前記テストシステムコントローラからの実行命令及び変数の設定値により、設定値の設定を行い、前記被試験対象と信号の授受を1ピン以上行える複数のピンエレクトロニクスカードと
を備えたことを特徴とするものである。

請求項2記載の発明は、請求項1記載の発明において、
テストシステムコントローラは、
少なくとも実行順データ、変数の設定値を記憶する第1の記憶部と、
この記憶部の実行順データ、変数の設定値に基づいて、実行命令及び設定の変数値を出力する第1の制御部と
を有し、

ピンエレクトロニクスカードは、
設定データ、実行順データを記憶する第2の記憶部と、
この第2の記憶部の実行順データに基づいて、第2の記憶部の設定データを準備し、前記第1の制御部の実行命令及び変数の設定値により、設定値を設定する第2の制御部と
を設けたことを特徴とするものである。

請求項 3 記載の発明は、請求項 1 または 2 記載の発明において、
ピンエレクトロニクスカードは、テストシステムコントローラから変数の設定値を受け取り、設定データの変数を固定値にすることを特徴とするものである。

請求項 4 記載の発明は、請求項 3 記載の発明において、
ピンエレクトロニクスカードは、所望の変数のみ固定値にすることを特徴とするものである。

請求項 5 記載の発明は、
被試験対象を試験する IC テスタにおいて、
実行命令を出力するテストシステムコントローラと、
設定値が定義される設定データとこの設定データの実行順が示される実行順データと
に基づいて、設定値データの設定準備を行い、前記テストシステムコントローラからの実
行命令により、設定値の設定を行い、前記被試験対象と信号の授受を 1 ピン以上行える複
数のピンエレクトロニクスカードと
を備えたことを特徴とするものである。

請求項 6 記載の発明は、請求項 5 記載の発明において、
テストシステムコントローラは、
少なくとも実行順データを記憶する第 1 の記憶部と、
この記憶部の実行順データに基づいて、実行命令を出力する第 1 の制御部と
を有し、
ピンエレクトロニクスカードは、
設定データ、実行順データを記憶する第 2 の記憶部と、
この第 2 の記憶部の実行順データに基づいて、第 2 の記憶部の設定データを準備し、前
記第 1 の制御部の実行命令により、設定値を設定する第 2 の制御部と
を設けたことを特徴とするものである。

請求項 7 記載の発明は、
被試験対象を試験する IC テスタにおいて、
実行命令を出力するテストシステムコントローラと、
設定値が定義される設定データ、この設定データの実行順が示される実行順データを記
憶する複数の記憶部と、
この記憶部の実行順データに基づいて、記憶部の設定データを準備し、前記テストシス
テムコントローラの実行命令により、設定値を設定する複数の制御部と
を設けたことを特徴とするものである。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0007

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0007】

請求項 1, 2, 5, 6 によれば、ピンエレクトロニクスカードが、事前に設定データを格納し、設定準備を行うので、その都度、テストシステムコントローラが設定値を送る必要がなくなり、試験時間を短縮することができる。

【手続補正 4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0008

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0008】

請求項 3, 4 によれば、ピンエレクトロニクスカードが変数を固定値と同じように扱うので、その都度、テストシステムコントローラがピンエレクトロニクスカードに変数の設定値を送る必要がなく、試験時間を短縮することができる。

請求項 7 によれば、記憶部が事前に設定データを格納し、制御部が設定準備を行うので、その都度、テストシステムコントローラが設定値を送る必要がなくなり、試験時間を短縮することができる。